

News Release

2014年7月14日
NRI サイバーパテント株式会社

パトリス抄録等データの著作権を譲り受け、商標を移転 ～特許情報の検索・閲覧サービスを一段と充実～

NRI サイバーパテント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高野 誠司、以下「NRI サイバーパテント」）は、2014年3月31日に解散し、現在清算中である株式会社新川情報（本社：東京都中央区、以下「旧パトリス」）から、パトリス（PATOLIS）抄録・フリーキーワードの著作権を譲り受けるとともに、「パトリス（PATOLIS）」の登録商標についても移転し、商標権を取得しました。

■「NRI サイバーパテントデスク 2」にて全内容の検索・閲覧が可能

NRI サイバーパテントでは、1971年から2012年までに発行された特許公報を要約したパトリス抄録、および抄録から抽出された技術用語であるフリーキーワードのデータに関して、旧パトリスから利用許諾を得た上で、特許情報サービス「NRI サイバーパテントデスク 2^{*}」を通じて、検索・閲覧サービスを提供してきました。2014年1月に、旧パトリスが全サービスを終了したことに伴い、同社の代理人との間で交渉を進めてきました。その結果、未利用分の2013年データを含む、1971年以降のパトリス抄録およびフリーキーワードの全ての著作権を、NRI サイバーパテントが取得しました。また、旧パトリスが保有していた国内3件の「パトリス」「PATOLIS」に関する登録商標についても移転し、商標権を取得しました。

これにより、「NRI サイバーパテントデスク 2」に未利用分を含むデータの追加収録を実施し、7月14日から全てのパトリス抄録およびフリーキーワードについて、検索・閲覧できるサービスを提供します。また、これらデータに関してバルク販売（技術分野や公報発行年、出願人・権利者単位でまとめたデータの販売）も開始します。

パトリス抄録等のデータは、旧パトリスが民営化される以前の財団法人の時代から作成されており、約1500万件と膨大かつ貴重なデータ群です。それが持つ特長は、下記の通りです。

■発明のポイントを明確に記載

パトリス抄録（正式名は「PATOLIS 抄録」）とは、特許公報に掲載された個々の発明を、技術者が、ポイントを明確にして分かりやすく記載したものです。そのため、複雑な特許情報であっても、閲覧者が迅速かつ正確に理解しやすい内容になっています。また、一定の文字数内で記載されており、客観性が高いため、テキストマイニングによる大規模な特許分析の素材としても有用です。

■重要な技術用語を抽出

「フリーキーワード」は、パトリス抄録の中から重要な技術用語を抽出したものです。抄録に含まれない重要な技術用語も「追加ワード」として抽出し、一度に閲覧できるようにしています。更に、特許公報によって異表記された技術用語を統一するために用いられる辞書（サーチガイド）についても、参照できるようデータベースが整備されています。

(NRI サイバーパテント 2 によるパトリス抄録・フリーキーワードのデータ提供のイメージ)

A	B	C	D	E	F	G	H
No.	出願番号	発明の名称	公報番号	出願人(最新)	要約	PATOLIS抄録・要約	PATOLISフリーキーワード
1	特開平2-246764	接触面圧分布の測定方法及びこれに使用する接触面圧測定モジュール	特開平4-125437	理化学研究所	【目的】単個物の凹凸は変動する両重を受ける被測定物が接触する接触面の全範囲にビントが合い、この接触面の接触面圧を同時に連続的に測定できる接触面圧分布測定装置の提供。【構成】塑性変形を生じさせる凸部18はプリズム12の第1面に当接し、凹部19はプリズム12の第1面に当接し、他面からの入射光を第3面→第1面→第3面で順次反射させ入射面で検出することにより、同時・連続的に測定可能とする。【構成】塑性変形を生じさせる凸部18はプリズム12の第1面に当接し、凹部19はプリズム12の第1面に当接し、他面からの入射光を第3面→第1面→第3面で順次反射させ入射面で検出することにより、同時・連続的に測定可能とする。【構成】塑性変形を生じさせる凸部18はプリズム12の第1面に当接し、凹部19はプリズム12の第1面に当接し、他面からの入射光を第3面→第1面→第3面で順次反射させ入射面で検出することにより、同時・連続的に測定可能とする。	【目的】直角プリズムの直角を成す第1面に凹凸面を当接し、他面からの入射光を第3面→第1面→第3面で順次反射させ入射面で検出することにより、同時・連続的に測定可能とする。【構成】塑性変形を生じさせる凸部18はプリズム12の第1面に当接し、凹部19はプリズム12の第1面に当接し、他面からの入射光を第3面→第1面→第3面で順次反射させ入射面で検出することにより、同時・連続的に測定可能とする。	接触面圧、接触面圧、分布、測定方法、使用、測定モジュール、直角プリズム、直角、第1面、凹部、第3面、順次反射、入射面、検出、同時、連続的測定、可能、塑性変形、凹凸、プリズム、背面、ステンレス、銅棒、試験片、圧力、印加、凸部面積、変化、側面板、窓、照射光、入射、検出器、輝度変化、画像処理、被測定物、接触面、全範囲、ビント、合い、連続的測定
2							
3							
4							

PATOLISフリーキーワード

発明の名称とPATOLIS抄録から技術用語を単一語ごとに抽出したキーワード。

昭和46年公開分から蓄積。旧パトリス社独自データ。

追加ワード

抄録に盛り込めなかった重要な技術用語は、以下に「追加ワード」として同時掲載。

NRI サイバーパテントは、今後も、知財関連ソリューションの提供を通じて、当該分野における企業のフルサポートパートナーとして、知財業務の効率化・高度化を支援していきます。

※「NRI サイバーパテントデスク 2 (NRI-CPD2)」:

NRI サイバーパテントが運営する、日本最初のインターネットによる特許情報サービス。国内外の特許・実用新案・意匠・商標などの情報を検索・閲覧でき、企業の知財部門や特許事務所はもとより、技術者・研究者・大学・研究機関の方々にも幅広く利用されている。(導入実績は約 3,000 社・機関)

サービスの詳細は、下記 Web サイトをご覧ください。

<http://www.patent.ne.jp/service/patent/index.html>

【ニュースリリースに関するお問い合わせ】

株式会社野村総合研究所 コーポレートコミュニケーション部 海藤、坂

TEL : 03-6270-8100 E-mail : kouhou@nri.co.jp

【製品・サービスに関するお問い合わせ】

NRI サイバーパテント株式会社 知的財産情報サービス事業部 田嶋

TEL : 03-5208-1011 E-mail : patent@nri.co.jp